

1. 会議の概要

名称:

Microoptics Conference (MOC) 2013

主催／共催機関:

The Japan Society of Applied Physics (JSAP), Microoptics Group, Optical Society of Japan (OSJ)

開催場所:

Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan

日時:

27-30, October, 2013

発表件数 (oral/poster) :

オーラル 57件 ポスター 73件

会議概要 (歴史・セッション構成など) :

MOCは特化した学会で、1987年に第1回目は日本で開催され、第9回まではそのままでした。その後、第10回目の記念会議の会場であるドイツ、韓国、台湾等の海外でも開催されるようになりました。今年は第18回目となります。発表セッションは技術別で整理され、「伝送技術およびデバイス」、「VCSELs」、「ディスプレイ・照射」、「光スイッチ」、「機能デバイス」、「インターコネクション」、「センシング」、「イメージング」といった分野にわたる「マイクロ」という技術で結びつけられた多彩な光技術が含まれています。

2. 発表内容

発表者名:

ナズィルル アファム (Nazirul Afham)

Title:

“Silica planar lightwave circuit collimator with UV-cured resin as integrated multilayered lenses”
(Session B – No. 6)

発表概要:

樹脂レンズを用いた石英導波路コリメータの実験結果を報告した。
波形の観察、焦点距離の測定、コリメータ動作の確認等を行いました。

反響と感想:

今年はゲストとして光通信分野の有名人である Christopher Doerr 氏や中沢正隆氏や Alan E. Willner 氏が参加し、興味深い発表をしました。聴講できてよかったですと思います。MOCには様々な分野を含んだ会議ですので光通信以外に関する発表も面白かったと思います。私はオーラルでは発表しました。聴講者が発表内容を理解してくれたとは思いますが、少し内容が少なめだと感じました。発表後には「デバイスの波長依存についてコメントをしてください」という質問をいただきました。